

分析走査型電子顕微鏡



| | |
|------|---|
| メーカー | 日本電子株式会社 |
| 型式 | JSM-IT500LA |
| 用途 | 金属、無機材料等の微小部の観察および元素分析 |
| 仕様 | <p>加速電圧: 0.3kV ~ 30kV 分解能: 高真空モード¹3.0nm(30kV) 15.0nm(1.0kV) 低真空モード²4.0nm(30kV 反射電子像) 撮影倍率: ×5~300,000(実用倍率2万倍程度、試料により異なります) 最大試料重量: 2kg 試料台寸法: φ51mm 試料高さ: 75mm以下 検出可能元素: Be~U</p> |